

КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЙ ПЕРЕНОС ЗАРЯДА ПОВЕРХНОСТНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНОЙ

© A.C.Бугаев, A.A.Захарова

Московский физико-технический институт,

111700 Долгопрудный, Россия

(Получена 30 ноября 1994 г. Принята к печати 29 марта 1995 г.)

Теоретически рассмотрен квазистационарный перенос заряда акустической волной в структурах на основе GaAs. Найдены условия формирования пакета заряда в потенциальной яме, создаваемой волной за счет пьезоэлектрического эффекта. Получены аналитические выражения для распределения концентрации электронов в пакете заряда и плотности тока в двумерной области переноса.

1. Введение

Перенос заряда акустической волной связан с эффектом увлечения носителей заряда (электронов) электрическим полем, сопровождающим волну, в полупроводнике с пьезоэлектрическими свойствами либо в слоистой структуре пьезоэлектрик-полупроводник. Если максимальное электрическое поле волны $E_{\max} < v_s/\mu$, где v_s — скорость звука, μ — подвижность носителей, то имеет место хорошо изученный как теоретически, так и экспериментально квазилинейный акустоэлектрический эффект. В этой ситуации заряд, инжектируемый в потенциальную яму, созданную волной, сносится назад в движущейся вместе с ней системе координат, поскольку электрическое поле волны недостаточно велико для переноса заряда со скоростью звука. При $E_{\max} > v_s/\mu$ носители заряда могут эффективно захватываться глубокой потенциальной ямой волны, формировать пакеты заряда и перемещаться вместе с волной со скоростью звука. Акустический перенос заряда поверхностью акустической волны (ПАВ) наблюдался в структурах на основе GaAs и Si, которые интенсивно исследуются экспериментально с целью создания целого класса новых приборов функциональной электроники — приборов с зарядовой связью на ПАВ [1–4]. В настоящей работе теоретически исследуется квазистационарный перенос заряда акустической волной.

Несмотря на значительное количество работ, посвященных акустическому переносу заряда (см., например, [5–11]), до сих пор не существует последовательной теории эффекта. Мы получили корректные

условия эффективного переноса заряда акустической волной, когда плотность тока утечки электронов из потенциальной ямы мала и форма пакета заряда может мало изменяться за время переноса. Показано, что стандартных условий $E_{\max} > v_s/\mu$, $\phi_0 \gg T/e$ (см., например, [7]), где ϕ_0 — амплитуда потенциала волны, e — абсолютная величина заряда электрона, T — температура, недостаточно для эффективного переноса заряда. Последнее связано с наличием диффузионного размытия пакета заряда. Найдены аналитические решения для квазистационарного распределения концентрации электронов в пакете заряда заданной величины и плотности тока носителей в двумерной области переноса. Решения строились аналогично [5] (см. также [6]), где рассматривалась одномерная модель, включающая уравнения непрерывности и Пуассона. Полученное распределение концентрации при квазистационарном переносе аналогично больцмановскому, где роль потенциала играет некоторый эффективный потенциал.

2. Теоретическая модель

Рассмотрим для определенности слоистую структуру на основе GaAs, изображенную на рис. 1. На полуизолирующей подложке выражен слой n -GaAs, используемый для переноса заряда. Прилегающий к этому слою металлический электрод, так же как и $n-i$ -переход, создает сильное контактное поле, которое приводит к обеднению области переноса носителями заряда. ПАВ возбуждается с помощью встречно-штыревых преобразователей и распространяется слева направо вдоль оси x . Электроны инжектируются в канал переноса электрическим полем через входной электрод, захватываются потенциальной ямой, создаваемой ПАВ, и переносятся к обратно смещенному выходному диоду, который преобразует заряд в выходное напряжение. Так же как и в работах [5–8], мы будем считать, что пакет заряда мало влияет на форму волны и ее скорость. Расчет параметров ПАВ в рассматриваемой структуре был проведен авторами [10], амплитуда волны равна нулю на границе слоя n -GaAs с металлическим электродом, мала в полуизолирующей подложке и достигает максимума примерно на полутолщине n -GaAs, если его толщина равна половине длины волны звука. На контакт Шоттки и полуизолирующую подложку подается напряжение, создающее потенциальную яму для электронов в центре слоя n -GaAs. Таким образом, максимум электрического потенциала в слое переноса приближенно совпадает с максимумом амплитуды ПАВ,

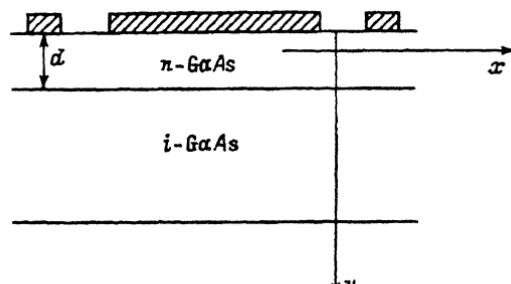


Рис. 1. Структура, используемая для акустического переноса заряда.

что создает благоприятные условия для захвата заряда и его переноса. При этом сверху и снизу пакет заряда ограничивается контактным потенциалом и потенциалом акустической волны, слева и справа — потенциалом ПАВ. Для описания процесса переноса заряда в двумерной области воспользуемся уравнениями непрерывности и Пуассона:

$$\begin{aligned} \partial n / \partial t + \partial j_x / \partial x + \partial j_y / \partial y &= 0, \\ j_x &= \mu \left[n \partial \phi / \partial x - (T/e) \partial n / \partial x \right], \\ j_y &= \mu \left[n \partial \phi / \partial y - (T/e) \partial n / \partial y \right], \\ \phi &= \phi^* + \phi_0(y) \cos(kx - \omega t), \\ \partial^2 \phi^* / \partial x^2 + \partial^2 \phi^* / \partial y^2 &= 4\pi(n - N)/\kappa. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь n — концентрация электронов, N — концентрация положительно заряженных доноров, ϕ — полный потенциал, ϕ^* — потенциал, создаваемый подвижным зарядом и донорами, $\phi_0(y) \cos(kx - \omega t)$ — потенциал, создаваемый ПАВ, k — волновой вектор, ω — частота ПАВ, κ — диэлектрическая проницаемость, ось y перпендикулярна плоскости структуры.

3. Условия квазистационарного переноса заряда

Рассмотрим квазистационарное решение для пакета заряда в движущейся системе координат. Переходим к переменным ξ , y , t , где $\xi = x - v_s t$. Тогда для квазистационарного распределения заряда уравнение непрерывности имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left[n \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\phi - \frac{v_s \xi}{\mu} \right) - \frac{T}{e} \frac{\partial n}{\partial \xi} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left(n \frac{\partial \phi}{\partial y} - \frac{T}{e} \frac{\partial n}{\partial y} \right) = 0. \quad (2)$$

Функция

$$n(\xi, y) = n_0 \exp \left\{ e \left[\phi(\xi, y) - v_s \xi / \mu \right] / T \right\} \quad (3)$$

является решением этого уравнения, где $\phi(\xi, y) = \phi^*(\xi, y) + \phi_0(y) \cos(k\xi)$, а $\phi^*(\xi, y)$ удовлетворяет двумерному уравнению Пуассона

$$\partial^2 \phi^* / \partial \xi^2 + \partial^2 \phi^* / \partial y^2 = 4\pi(n - N)/\kappa. \quad (4)$$

В (3) n_0 — постоянная интегрирования. Функция распределения (3) отличается от Больцмановской наличием потенциала $-v_s \xi / \mu$. Ее можно рассматривать как квазибольцмановскую с эффективным потенциалом

$$\phi_{\text{eff}} = \phi(\xi, y) - v_s \xi / \mu. \quad (5)$$

Экстремумы $n(\xi, y)$ соответствуют экстремумам эффективного потенциала, который для случая, когда пакет заряда мало искажает потенциал, в центре слоя n -GaAs при $y = y_m$ имеет следующий вид:

$$\phi_{\text{eff}} = \phi_0(y_m) \cos(k\xi) - v_s \xi / \mu + \phi_N(y_m). \quad (6)$$

Здесь $\phi_N(y)$ — потенциал, создаваемый заряженными донорами и зарядами на металлических электродах. Тогда, дифференцируя ϕ_{eff} по ξ , находим, что максимум $n(\xi, y)$ находится в центре слоя $n\text{-GaAs}$ (при $y = y_m$) в области, где скорость дрейфа электронов совпадает со скоростью звука. Если максимальное поле ПАВ E_{\max} больше v_s/μ , то существуют две точки на длине волны λ , для которых эти скорости совпадают. Одна из них (ξ_1, y_m) соответствует максимуму ϕ_{eff} , другая (ξ_2, y_m) — минимуму при $y = y_m$. Тогда точка (ξ_1, y_m) соответствует максимуму концентрации электронов в пакете, точка (ξ_2, y_m) — минимуму. Точка $(\xi_2 + \lambda, y_m)$ соответствует второму минимуму концентрации электронов в пакете. При $E_{\max} < v_s/\mu$ функция $\phi_{\text{eff}}(\xi, y)$ не имеет экстремумов и перенос пакета заряда потенциальной ямой, создаваемой ПАВ, невозможен. Согласно (6) $\phi_{\text{eff}}(\xi_2 + \lambda) < \phi_{\text{eff}}(\xi_2)$, тогда $n(\xi_2 + \lambda, y_m) < n(\xi_2, y_m)$. При $\xi < \xi_2$ согласно решению (3) $n(\xi, y)$, осциллируя, неограниченно нарастает. Поэтому полученное решение не является стационарным для пакета заряда, захваченного в потенциальную яму, создаваемую ПАВ. Однако если $\phi_{\text{eff}}(\xi_1, y_m) - \phi_{\text{eff}}(\xi_2, y_m) \gg \gg T/e$, утечка электронов из потенциальной ямы может происходить медленно, так как их концентрация незначительна при $(\xi, y_m) = (\xi_2, y_m)$, и форма пакета может мало изменяться за время его переноса от входного электрода к выходному. Используя (6), находим ξ_1 и ξ_2 :

$$\begin{aligned}\xi_1 &= -\arcsin\left\{v_s/\mu k \phi_0(y_m)\right\}/k, \\ \xi_2 &= -\pi/k + \arcsin\left\{v_s/\mu k \phi_0(y_m)\right\}/k.\end{aligned}\quad (7)$$

Используя (6), (7), получаем

$$\begin{aligned}\phi_{\text{eff}}(\xi_1, y_m) - \phi_{\text{eff}}(\xi_2, y_m) &= 2\phi_0(y_m) \left[1 - \frac{v_s^2}{k^2 \phi_0^2(y_m) \mu^2}\right]^{1/2} - \\ &- \frac{v_s}{\mu k} \left[\pi - 2 \arcsin\left(\frac{v_s}{\sqrt{\mu k \phi_0(y_m)}}\right)\right].\end{aligned}\quad (8)$$

При

$$2\phi_0(y_m) \left[1 - \frac{v_s^2}{k^2 \phi_0^2(y_m) \mu^2}\right]^{1/2} - \frac{v_s}{\mu k} \left[\pi - 2 \arcsin\left(\frac{v_s}{\sqrt{\mu k \phi_0(y_m)}}\right)\right] \gg \frac{T}{e} \quad (9)$$

возможно формирование квазистационарного распределения концентрации электронов (3) в потенциальной яме, создаваемой ПАВ. Отметим, что при $v_s/\mu = k\phi_0(y_m)$ максимальное поле ПАВ совпадает с полем синхронного переноса заряда. В этом случае левая часть (9) обращается в ноль и неравенство не выполняется. Поэтому максимальное поле ПАВ должно быть больше поля синхронного переноса для достижения эффективного переноса заряда. Неравенство (9) несправедливо также, если не выполняется условие $\phi_0(y_m) \gg T/e$. Однако полученное условие (9) не эквивалентно этим двум хорошо известным условиям эффективного переноса заряда акустической волной.

При $T/e \ll v_s/\mu k$ представим $\phi_0(y_m)$ в виде $\phi_0(y_m) = \phi_s + \Delta\phi$, где $\phi_s = v_s/\mu k$ соответствует амплитуде потенциала волны, для которого максимальное поле равно полю синхронного переноса. Если $|\Delta\phi| \ll \phi_s$, то неравенство (9) можно переписать следующим образом:

$$\Delta\phi \gg (T/e)^{2/3} \phi_s^{1/3} = (T/e)^{2/3} (v_s/\mu k)^{1/3}. \quad (10)$$

Оценка $\Delta\phi$ (10) верна, если $T/e \ll v_s/\mu k$, когда правая часть (10) существенно меньше ϕ_s . В этой ситуации $\phi_0(y_m) \gg T/e$, а максимальное поле акустической волны должно превышать поле синхронного переноса на величину

$$\Delta E \gg k(T/e)^{2/3} \phi_s^{1/3}. \quad (11)$$

При этом правая часть (11) существенно меньше поля синхронного переноса.

В противоположном случае, $T/e > v_s/\mu k$, неравенство (9) эквивалентно следующему:

$$\phi_0(y_m) \gg T/e. \quad (12)$$

При $T/e > v_s/\mu k$ оценка необходимого значения $\phi_0(y_m)$ дает соответствующее значение максимального электрического поля волны, намного превышающее поле синхронного переноса.

4. Распределение носителей в пакете заряда и плотности тока в двумерной области

В рассматриваемом предельном случае $n \ll N$, когда пакет заряда мало искажает потенциал, найдем двумерное распределение потенциала, эффективного потенциала и носителей заряда. Полагая

$$Ned^2/\kappa \gg \phi_0(y_m), \quad (13)$$

пренебрежем зависимостью потенциала ПАВ от координаты y вблизи центра слоя n -GaAs. Это возможно, поскольку согласно (13) функция $\phi_0(y)$ является существенно более плавной, чем функция $\phi_N(y)$, описывающая потенциал, создаваемый заряженными примесями и зарядами на электродах. При $n \ll N$ из (4) находим

$$\phi^*(\xi, y) = \phi_N(y_m) - 2\pi Ne(y - y_m)^2/\kappa. \quad (14)$$

Используя это выражение и выбирая $\phi_N(y_m) = 0$, находим двумерное распределение потенциала при $|y - y_m| \ll d$,

$$\phi(\xi, y) = \phi_0(y_m) \cos(k\xi) - 2\pi Ne(y - y_m)^2/\kappa, \quad (15)$$

и эффективного потенциала,

$$\phi_{\text{eff}}(\xi, y) = \phi_0(y_m) \cos(k\xi) - v_s \xi / \mu - 2\pi Ne(y - y_m)^2/\kappa. \quad (16)$$

Тогда распределение электронов в пакете заряда определяется формулой (3), где значение эффективного потенциала в числителе показателя экспоненты определяется выражением (16). Отметим, что в случае Больцмановского распределения $n \sim \exp(e\phi/T)$, где ϕ определяется выражением (15).

Зададим полное число электронов в пакете заряда на единицу длины $\bar{n}\lambda d$ следующим образом:

$$\bar{n}\lambda d = \int_{\xi_2}^{\xi_2 + \lambda} d\xi \int_{-d/2}^{d/2} dy n(\xi, y). \quad (17)$$

Здесь \bar{n} — концентрация электронов в пакете, усредненная по длине волны λ и толщине слоя n -GaAs d . Если глубина потенциальной ямы для электронов существенно больше температуры, то

$$Ne^2 d^2 / \kappa T \gg 1. \quad (18)$$

С учетом (18) пределы интегрирования в (17) по y можно заменить на $\pm\infty$. Тогда, используя (3), (5), (16), после интегрирования (17) имеем

$$\bar{n} = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{T\kappa}{2Ne^2 d^2} \right)^{1/2} \int_{\xi_2}^{\xi_2 + \lambda} d\xi n(\xi, y_m). \quad (19)$$

Подставляя в (19) концентрацию электронов из (3) и используя выражения (5), (16), находим постоянную интегрирования n_0 :

$$n_0 = \bar{n}\lambda \left(\frac{2Ne^2 d^2}{T\kappa} \right)^{1/2} \left(\int_{\xi_2}^{\xi_2 + \lambda} \exp \left\{ e[\phi_0(y_m) \cos(k\xi) - v_s \xi / \mu] / T \right\} d\xi \right)^{-1}. \quad (20)$$

Тогда квазистационарное распределение электронов в потенциальной яме ПАВ имеет следующий вид:

$$n(\xi, y) = \bar{n}\lambda \left(\frac{2Ne^2 d^2}{T\kappa} \right)^{1/2} \exp \left(\frac{e[\phi_0(y_m) \cos(k\xi) - \xi v_s / \mu - 2\pi Ne(y - y_m^2) / \kappa]}{T} \right) \times \\ \times \left[\int_{\xi_2}^{\xi_2 + \lambda} \exp \left(\frac{e[\phi_0(y_m) \cos(k\xi) - v_s \xi / \mu]}{T} \right) \right]^{-1}. \quad (21)$$

Оно определяется полным числом электронов в пакете заряда на единицу длины $\bar{n}\lambda d$ и распределением эффективного потенциала в области переноса.

Аналогично (21) можно найти $n(\xi, y)$ при больцмановском распределении, которое использовалось авторами [8,9] при численном моделировании процесса переноса заряда ПАВ, а также авторами [7] при расчете плотности тока утечки электронов в структурах на основе GaAs:

$$n(\xi, y) = \bar{n}\lambda \left(\frac{2Ne^2 d^2}{T\kappa} \right)^{1/2} \exp \left(\frac{e[\phi_0(y_m) \cos(k\xi) - 2\pi Ne(y - y_m^2) / \kappa]}{T} \right) \times \\ \times \left[\int_{\xi_2}^{\xi_2 + \lambda} d\xi \exp \left(\frac{e\phi_0(y_m) \cos(k\xi)}{T} \right) \right]^{-1}. \quad (22)$$

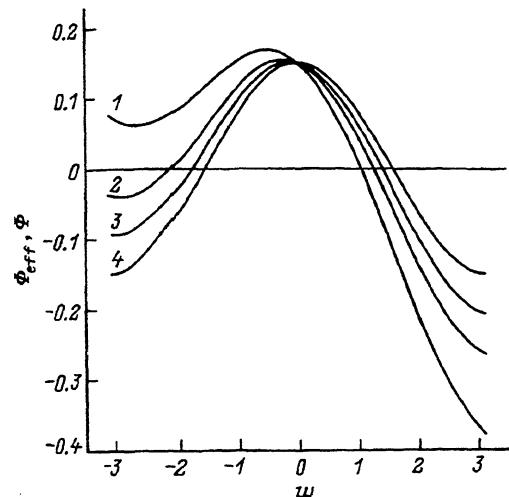


Рис. 2. Распределение эффективного потенциала при $\phi_0(y_m) = 0.15$ В и значениях подвижности электронов в слое n -GaAs μ , см²/В·с: 1 — $0.5 \cdot 10^3$, 2 — $1 \cdot 10^3$, 3 — $2 \cdot 10^3$. 4 — распределение электрического потенциала.

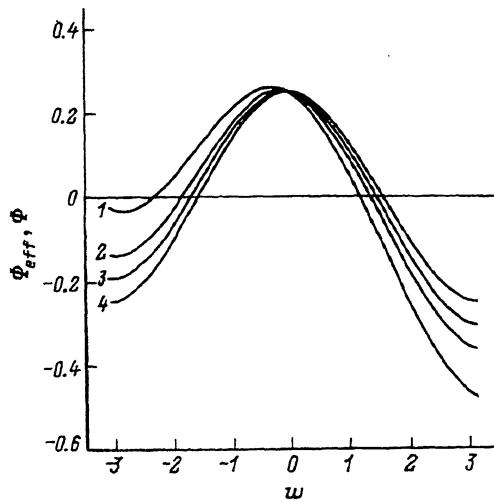


Рис. 3. Распределение эффективного потенциала при $\phi_0(y_m) = 0.25$ В и значениях подвижности электронов в слое n -GaAs μ , см²/В·с: 1 — $0.5 \cdot 10^3$, 2 — $1 \cdot 10^3$, 3 — $2 \cdot 10^3$. 4 — распределение электрического потенциала.

При этом полное число электронов на единицу длины равно $\bar{n}\lambda d$. Экстремумы функции $n(\xi, y)$ согласно (22) соответствуют экстремумам потенциала $\phi(\xi, y)$ (15) и не совпадают с экстремумами концентрации согласно формуле (22), описывающей квазистационарное распределение носителей заряда. Однако они также расположены при $y = y_m$. При $y \neq y_m$ $n(\xi, y)$ быстро падает как в случае распределения (21), так и в случае распределения (22). Причем в обоих случаях зависимость от y имеет вид

$$n(\xi, y) \sim \exp \left[-2\pi Ne^2(y - y_m)^2/\kappa T \right], \quad (23)$$

поскольку зависимости потенциала и эффективного потенциала от координаты y идентичны согласно формулам (15) и (16).

Распределение плотности тока электронов в пренебрежении током утечки из потенциальной ямы, создаваемой ПАВ, имеет вид

$$j(x, y, t) = -ev_s n(x - v_s t, y), \quad (24)$$

где $n(x - v_s t, y)$ определяется формулой (21). При этом распределение плотности тока подвижного заряда с точностью до постоянного множителя совпадает с распределением концентрации. Обозначим $j = -ev_s \bar{n}$, тогда $j/j = n/\bar{n}$. Здесь величина j соответствует плотности тока, усредненной по длине волны звука и толщине слоя n -GaAs.

Вычислим распределения потенциала, эффективного потенциала концентрации электронов и плотности тока при $y = y_m$ для рассматриваемой структуры. Используем следующие значения параметров: $N = 10^{15}$ см⁻³, $d = 4 \cdot 10^{-4}$ см, $\lambda = 2d$, $v_s = 2.864 \cdot 10^5$ см/с, $T = 300$ К. На рис. 2 изображены зависимости $\phi(\xi, y_m)$ и $\Phi_{eff}(\xi, y_m)$ от $w = 2\pi\xi/\lambda$

при $\phi_0(y_m) = 0.15$ В и различных значениях подвижности электронов в слое n -GaAs. На рис. 3 — соответствующие зависимости при $\phi_0(y_m) = 0.25$ В. Для всех вариантов условие (9) выполняется, поэтому эффективный потенциал имеет хорошо выраженные экстремумы. С уменьшением подвижности электронов и амплитуды потенциала ПАВ экстремумы ϕ_{eff} смещаются в сторону, противоположную направлению распространения ПАВ, что приводит к соответствующему смещению распределений концентрации и плотности тока. Это иллюстрируют рис. 4 и 5, на которых изображены зависимости $n/\bar{n} = j/j$ от $w = 2\pi\xi/\lambda$ при $y = y_m$. Рис. 4 соответствует $\phi_0(y_m) = 0.15$ В, рис. 5 — $\phi_0(y_m) = 0.25$ В. Для сравнения приведены также кривые, соответствующие болцмановскому распределению. С увеличением подвижности электронов и амплитуды потенциала ПАВ максимальные значения концентрации носителей и плотности тока в пакете заряда растут, так как уменьшается диффузионное размытие пакета заряда. Ввиду несимметричности распределения (21) число электронов, обладающих большой потенциальной энергией и, следовательно, способных покинуть потенциальную яму, в этом случае существенно больше, чем в случае распределения Больцмана. При $\phi_{\text{eff}}(\xi_2, y_m) - \phi(\xi_2, y_m) \gg T/e$ (это неравенство выполняется для всех рассмотренных ситуаций), $n(\xi_2, y_m)$ во много раз больше для квазибольцмановского распределения. Величина тока утечки из ямы в первом случае должна оказаться также значительно больше, что существенно уменьшит соответствующую величину эффективности переноса заряда ПАВ, которая является важнейшей характеристикой приборов с акустическим переносом заряда и определяется отношением тока утечки из ямы к току пакета заряда. Поэтому расчеты этой величины с использованием распределения Больцмана некорректны. Корректный расчет эффективности переноса заряда требует выхода за рамки модели квазистационарного переноса.

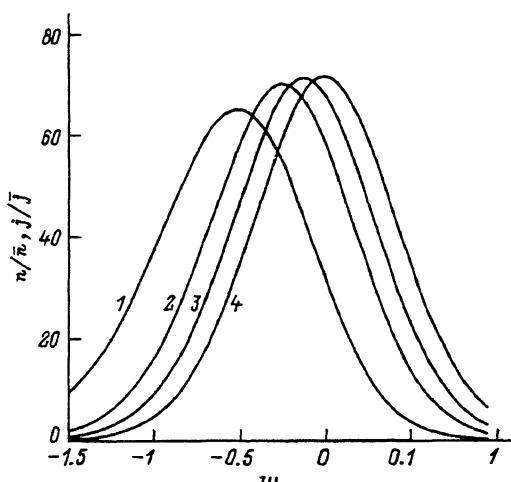


Рис. 4. Распределение концентрации и плотности тока в пакете заряда при $\phi_0(y_m) = 0.15$ В. $\mu, \text{см}^2/\text{В}\cdot\text{с}:$ 1 — $0.5 \cdot 10^3$, 2 — $1 \cdot 10^3$, 3 — $2 \cdot 10^3$. 4 — соответствует болцмановскому распределению.

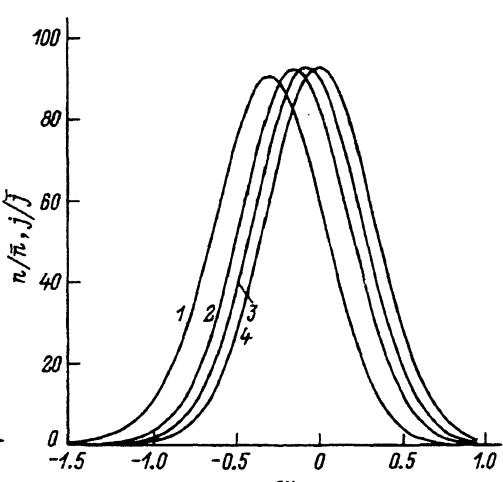


Рис. 5. Распределение концентрации и плотности тока в пакете заряда при $\phi_0(y_m) = 0.25$ В. $\mu, \text{см}^2/\text{В}\cdot\text{с}:$ 1 — $0.5 \cdot 10^3$, 2 — $1 \cdot 10^3$, 3 — $2 \cdot 10^3$. 4 — соответствует болцмановскому распределению.

Список литературы

- [1] А.С. Бугаев, Ю.В. Гуляев, И.И. Сахацкий, В.А. Яценко. Зарубеж. радиоэлекtron., № 3, 23 (1991).
- [2] M.J. Hoskins, H. Morkoc, B.J. Hunsinger. Appl. Phys. Lett., **41**, 332 (1982).
- [3] B. Schmukler, M.J. Hoskins. Appl. Phys. Lett., **52**, 428 (1988).
- [4] B.C. Beggs, L. Young, R.R. Johnson. J. Appl. Phys., **63**, 2425 (1988).
- [5] Ю.В. Гуляев, А.С. Бугаев, В.Н. Хитров, Н.Н. Шибанова. В кн.: *Вопросы теории и практического использования поверхности акустических волн* (М., МЭИ, 1989) № 2, с. 22.
- [6] F.L. Augustine, R.J. Schwartz, R.L. Gunshor. IEEE Trans. Electron. Dev., **ED-29**, 1876 (1982).
- [7] M.J. Hoskins, B.J. Hunsinger. J. Appl. Phys., **55**, 413 (1984).
- [8] G.A. Peterson, B.J. McGartin, W.J. Tanski, R.E. LaBarre. Appl. Phys. Lett., **55**, 1330 (1989).
- [9] S.M. Knapp, J.J. Lion, D.C. Malocha, In: *Proc. IEEE Ultrasonics symp.* (1989) p. 223.
- [10] S.M. Knapp, J.J. Lion, D.C. Malocha. In: *Proc. IEEE Ultrasonics symp.* (1990) p. 243.
- [11] S. Datta, B.J. Hunsinger. J. Appl. Phys., **49**, 475 (1978).

Редактор Л.В. Шаронова

A quasi-stationary charge transport by a surface acoustic wave

A.S.Bugaev, A.A.Zakharova

Moscow Physicotechnical Institute, 111700 Dolgoprudny, Russia
